

## FICHA DE NOVO COMPONENTE CURRICULAR DA PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* - UFPE

<b>NOME DO PROGRAMA:</b>	Engenharia Aeroespacial
<b>CENTRO:</b>	Centro de Tecnologia e Geociências

DADOS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA			
<b>NOME DO DOCENTE RESPONSÁVEL</b>			
<b>OFERTA:</b>	<input type="checkbox"/> 1º semestre	<input type="checkbox"/> 2º semestre	<input type="checkbox"/> 1º e 2º semestres
<b>COMPONENTE DO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> mestrado	<input type="checkbox"/> doutorado	
<b>OBRIGATÓRIA</b>	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
<b>CARGA HORÁRIA:</b>	<b>TEÓRICAS:</b>	hs	<b>PRÁTICAS:</b> hs
<b>COMPONENTE PRÉ-REQUISITO</b>	<b>CÓDIGO:</b>		<b>NOME:</b>

DADOS DO COMPONENTE			
<b>NOME DO COMPONENTE:</b>	PEA917 - Difração de Raios-X e Refinamento RIETVELD		
<b>CARGA HORÁRIA:</b>	60 hs	<b>TIPO DE COMPONENTE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> disciplina <input type="checkbox"/> atividade
		<b>COMPONENTE FLEXÍVEL:</b>	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
<b>EMENTA:</b>	<p><b>Conteúdo programático:</b> Fundamentos da rede cristalina; Propriedades, fontes e detecção de raios-X; Fundamentos da difração; Padrão de difração de policristais; Fator de estrutura; Refinamento Rietveld, análise qualitativa e quantitativa de fases e tamanho de cristalito e microstrain.</p>		
<b>REFERÊNCIAS:</b>	<p>V. K. Pecharsky and P. Y. Zavalij, Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Springer, (2009). R. E. Dinnebier and S. J. L. Billinge, Powder Diffraction: Theory and Practice, RSC Publishing, (2008). R.A. Young, "The Rietveld Method", Oxford: University Press, (1993).</p>		